

УДК 621.315.572

## ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВАЛЕНТНЫХ И ОСТОВНЫХ ЭЛЕКТРОНОВ В ПОЛУПРОВОДНИКАХ

*O. A. Макаров, И. Г. Неизвестный, М. П. Синюков*

Экспериментально установлено влияние электронов остовных уровней на плазменную частоту валентных электронов в полупроводниках.

Ранее [1, 2] мы сообщали об измерении плазменных частот валентных электронов в германии и кремнии.

Высокая плотность валентных электронов в полупроводниках приводит к тому, что частоты их коллективных возбуждений — плазменные колебания валентных электронов — лежат в ВУФ области спектра. В этой области спектра ( $\hbar\omega \approx 10 \text{--} 30 \text{ эВ}$ ) отражательная способность полупроводников определяется коллективными свойствами валентных электронов, поскольку интенсивность переходов электронов из валентной зоны в зону проводимости при энергиях кванта света выше 10 эВ становится незначительной. На этих частотах валентные электроны ведут себя как свободные, поскольку энергия связи валентных электронов с кристаллической решеткой существенно меньше, чем энергия плазменных колебаний. При этом оптические константы полупроводника в этой области энергий фотонов будут определяться, как для «газа свободных валентных электронов» с плазменной частотой

$$\omega_{pe}^2 = 4\pi N_e e^2 / m, \quad (1)$$

где  $N_e$  — плотность валентных электронов;  $e$ ,  $m$  — заряд и масса свободного электрона. Однако это справедливо только в отсутствие электронов остовных уровней, расположенных близко по энергии. Согласно Филиппу и Эренрайху [3], взаимодействие валентных электронов с электронами остовных уровней приводит к увеличению плазменной частоты

$$\Omega'_{pe}^2 = \omega_{pe}^2 + m^{-1} (\epsilon/\pi)^2 \int d^3 k f_{vd}, \quad (2)$$

где  $f_{vd}$  — сила осциллятора для взаимодействия электронов валентной зоны с электронами остовных уровней. Вместе с этим положение наблюдаемого в спектрах отражения плазменного края  $\Omega_{pe}$  зависит еще и от поляризуемости электронов остовных уровней

$$\Omega_{pe}^2 = \Omega'_{pe}^2 / (1 + \delta\epsilon_0), \quad (3)$$

где  $\delta\epsilon_0$  — вклад электронов остовных уровней в поляризуемость. Таким образом, влияние электронов остовных уровней может привести к увеличению  $\Omega_{pe}$ , если будет преобладать интегральный член в (2), или к уменьшению, если будет преобладать член  $\delta\epsilon_0$  в (3).

Цель настоящей работы — исследовать влияние электронов остовных уровней на плазменную частоту валентных электронов. Для проведения эксперимента мы выбрали следующие полупроводники: кремний, германий и теллурид свинца. Они характеризуются различным энергетическим

положением оставших уровней. Так, в теллуриде свинца переходы с  $5d$ -уровней свинца начинаются при  $\hbar\omega = 18$  эВ, в германии переходы с  $3d$ -уровней германия — при  $\hbar\omega = 30$  эВ, а в кремнии переходы с  $2p$ -уровней кремния — при  $\hbar\omega$  более 100 эВ. Таким образом, можно было ожидать, что кремний относится к полупроводникам с хорошо изолированной валентной зоной, в то время как германий и теллурид свинца — к полупроводникам с близко расположенными уровнями оставших электронов, которые должны эффективно взаимодействовать с валентными электронами.

Значение плазменной частоты валентных электронов может быть получено из измерений спектра отражения полупроводника и вычисления на его основе функции  $-\text{Im } \epsilon^{-1}(\omega)$ , что и было сделано в [3]. Нами был предложен и реализован несколько улучшенный способ определения  $\Omega_p$ , — по плазменному краю в спектрах отражения тонких полупроводниковых пленок [1, 2]. Кроме того, впервые была экспериментально установлена прозрачность полупроводников в ВУФ области спектра.

Пленки кремния, германия и теллурида свинца толщиной в несколько сотен ангстрем были выращены методом молекулярной эпитаксии на подложках из сапфира, арсенида галлия и фтористого бария соответственно. Спектры отражения, как и в [1, 2], получены на установке, использующей в качестве источника синхротронного излучения накопительное кольцо ВЭПП-2М [4].

На рис. 1 приведен спектр отражения пленки теллурида свинца. Он характеризуется наличием осциллирующей интерференционной части спектра при энергиях кванта  $\hbar\omega \geq 20$  эВ, что обусловлено прозрачностью пленки за плазменным краем. Кружком выделена область, соответствующая одночастичным переходам с  $5d$ -уровней свинца в зону проводимости. Эти переходы наблюдаются более отчетливо в спектрах массивных образцов, когда они не искажаются интерференционными явлениями. Спектры пленок германия и кремния имели аналогичный вид.

Определение значений плазменных частот из экспериментальных спектров производилось с помощью сравнения с теоретическим спектром отражения. В расчете использованы формулы Френеля для вычисления коэффициента отражения от полупроводниковой пленки, расположенной на полубесконечной подложке. Диэлектрическая функция пленки описывалась выражением

$$\epsilon(\hbar\omega) = 1 - [\hbar\Omega_{pv}/(\hbar\omega + i\hbar/\tau)]^2. \quad (4)$$

где  $\tau$  — время релаксации плазменных колебаний. Значения параметров рассчитывались с помощью подгонки методом наименьших квадратов.

Параметры исследуемых образцов (в эВ)

	$\hbar\omega_{pv}$	$\hbar\Omega_{pv}$	$\hbar\Omega_{pv}$ [3]	$\hbar\Omega'_{pv}$
	1	2	3	4
PbTe	10.06	13.1	—	16.2
Ge	15.64	15.8	16.0	24.3
Si	16.59	16.8	16.4	16.59

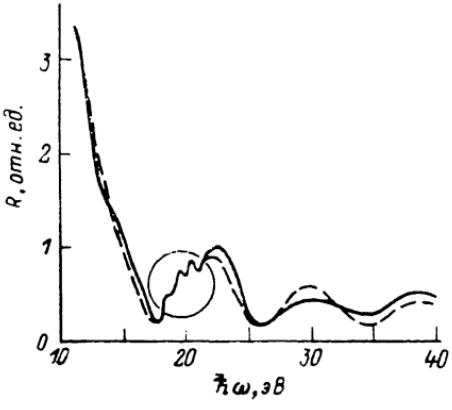


Рис. 1. Спектр отражения пленки теллурида свинца толщиной 54 нм, выращенной на подложке из фтористого бария.

Для сравнения с экспериментом были рассчитаны плазменные частоты «газа свободных электронов» с помощью выражения (1). Плотность валентных электронов определялась с помощью табличных данных. Рассчитанные значения  $\hbar\omega_p$ , приведены в стб. 1 таблицы. В частности, для теллурида свинца были использованы значения плотности  $8.16 \text{ г/см}^3$  и молекулярного веса  $334.9 \text{ г/моль}$ . Найденные нами значения энергий плазменных колебаний  $\hbar\Omega_p$ , для исследованных образцов приведены в стб. 2 таблицы. Штрихом на рис. 1 показан расчетный спектр отражения, полученный при  $\hbar\Omega_p = 13.1$  и  $\hbar/\tau = 2.76 \text{ эВ}$ . В стб. 3 таблицы приведены значения  $\hbar\Omega_p$ , для германия и кремния, определенные в [3] из измерений спектров отражения массивных образцов по максимуму функции  $-\text{Im } \varepsilon^{-1}(\omega)$ . Значения  $\Omega_p$  и  $\omega_p$ , для кремния и германия совпали с точностью лучше 2 %. Это совпадение лежит в пределах ошибки определения  $\Omega_p$ , по спектрам отражения тонких пленок. Для теллурида свинца влияние близко расположенного оставного уровня проявляется в значительном отличии  $\hbar\Omega_p = 13.1 \text{ эВ}$  от  $\hbar\omega_p = 10.06 \text{ эВ}$ . Более детально влияние оставных уровней можно проследить, разделив два противоположных механизма их влияния на плазменную частоту  $\Omega_p$ . Для этого в стб. 4 таблицы приведены значения энергий плазменных колебаний  $\hbar\Omega'_p$ , которые наблюдались бы в отсутствие эффектов экранировки, обусловленных вкладом электронов оставных уровней в поляризуемость, как это представлено в выражении (3).

Для расчета значений  $\Omega'_p$  необходимо воспользоваться правилами сумм, т. е. рассчитать эффективную плотность электронов — плотность валентных электронов, увеличенную за счет взаимодействия осцилляторов  $v$  и  $d$ -зон

$$\frac{2\pi^2 Ne^2}{m} n_{\text{эфф}} = \int_0^{\omega_0} \omega \epsilon_2(\omega) d\omega, \quad (5)$$

где  $N$  — плотность атомов вещества;  $\omega_0$  — предельная частота, при которой насыщается сумма сил осцилляторов для переходов из валентной зоны в зону проводимости. С другой стороны,  $\Omega'_p$  можно определить с помощью выражения (3), рассчитав вклад электронов оставных уровней в поляризуемость

$$\epsilon_0 \text{эфф} = 1 + \frac{2}{\pi} \int_0^{\omega_0} \omega^{-1} \epsilon_2(\omega) d\omega, \quad (6)$$

$\epsilon_0 \text{эфф}$  — эффективная диэлектрическая проницаемость, возникающая за счет межзонных переходов. При  $\omega_0 \rightarrow \infty$  величина  $\epsilon_0 \text{эфф}$  преобразуется к виду  $\epsilon_0 \text{эфф} = \epsilon_0 + \delta\epsilon_0$ , где член  $\epsilon_0$ , обусловлен валентными электронами, а  $\delta\epsilon_0$  представляет собой вклад оставных электронов в низкочастотную диэлектрическую проницаемость.

Диэлектрическую проницаемость можно рассчитать с помощью анализа Крамеса—Кронига. С этой целью в диапазоне от 4 до 40 эВ были записаны спектры отражения массивных образцов, а для расширения пределов интегрирования в длинноволновую область привлекались литературные данные. На рис. 2, 3 приведены результаты вычисления  $n_{\text{эфф}}$  и  $\epsilon_0 \text{эфф}$  для теллурида свинца. Зависимость  $n_{\text{эфф}}(\hbar\omega)$  обнаруживает два отчетливых перегиба при 5 и 18 эВ. Оба они обусловлены особенностями в спектре отражения. Первый — переходами из  $\Delta_6$  валентной зоны в зону проводимости, второй — переходами  $5d$ -электронов свинца в зону проводимости. Возрастание  $n_{\text{эфф}}$  выше 5 электронов на атом при энергиях, меньших 18 эВ, связано, очевидно, с перемешиванием сил осцилляторов между валентной и  $d$ -зонами. Чтобы оценить величину  $\Omega'_p$ , необходимо из величины  $n_{\text{эфф}}$  исключить вклад, обусловленный переходами  $5d$ -электронов

свинца в зону проводимости. Поэтому была проведена экстраполяция зависимости  $n_{\text{эфф}}(\hbar\omega)$  для энергий фотонов выше 18 эВ (штриховая линия на рис. 2). Эта часть зависимости испытывает насыщение при  $\hbar\omega \approx 30$  эВ и выходит на величину  $n_{\text{эфф}} \approx 13$ , что позволяет определить значение  $\hbar\Omega'_{pv} \approx 16.2$  эВ.

Зависимость  $\epsilon_0 \text{эфф}$  выходит на насыщение уже при  $\hbar\omega \approx 10$  эВ. Для определения  $\delta\epsilon_0$  нужно из  $\epsilon_\infty$  вычесть величину  $\epsilon_0 \text{эфф}$  в насыщении. На рис. 3 эта величина около 35—36. Согласно работе [5], для теллурида свинца  $\epsilon_\infty = 33$ . Однако проведенные нами измерения ИК спектров отражения пленок теллурида свинца приводили к значению  $\epsilon_\infty$  в интервале от 35 до 38. Поэтому для оценки вклада оставших уровней в поляризуемость теллурида свинца мы воспользовались соотношением (3) и получили  $\delta\epsilon_0 \approx 0.24$ .

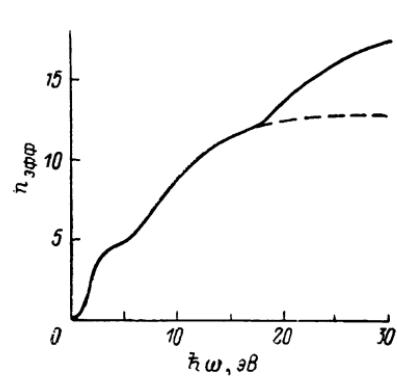


Рис. 2. Расчет эффективной плотности  $n_{\text{эфф}}$  (электронов на атом) для PbTe.

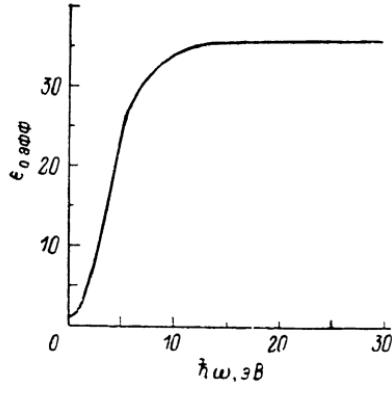


Рис. 3. Расчет эффективной диэлектрической проницаемости для PbTe.

Что касается германия, то для него, наоборот, оказалось затруднительным определить величину, которая соответствует насыщению зависимости  $n_{\text{эфф}}(\hbar\omega)$ . В то же время по зависимости  $\epsilon_0 \text{эфф}(\hbar\omega)$  достаточно корректно определялась величина  $\delta\epsilon_0 \approx 0.5$ . Используя затем (3), можно было оценить для германия  $\hbar\Omega'_{pv} \approx 24.3$  эВ и  $n_{\text{эфф}} \approx 10$ .

Для кремния зависимость  $n_{\text{эфф}}(\hbar\omega)$  выходит на насыщение уже при  $\hbar\omega \approx 20$  эВ на ожидаемое значение — 4 электрона на атом, а  $\epsilon_0 \text{эфф}$  в насыщении соответствует значению  $\epsilon_\infty$ . Это позволяет сделать вывод, что взаимодействием валентных электронов с оставшимися можно пренебречь, так же как и вкладом оставших электронов в поляризуемость. Следовательно, для кремния  $\Omega'_{pv} = \omega_{pv}$  и  $\delta\epsilon_0 = 0$ .

На основании полученных экспериментальных данных и теоретических представлений, развитых Филиппом и Эренрайхом, можно проанализировать влияние электронов оставших уровней на плазменную частоту валентных электронов. Так, для кремния, где ближайший оставшийся уровень  $2p$ -электронов отстоит от потолка валентной зоны на величину более 100 эВ, электроны оставших уровней не вносят сколько-нибудь заметного вклада в поляризуемость и их взаимодействием с электронами валентной зоны практически можно пренебречь. В германии ближайший оставшийся уровень  $3d$ -электронов расположен на расстоянии около 30 эВ от потолка валентной зоны. Несмотря на то что экспериментально измеренное значение плазменной частоты валентных электронов  $\Omega_{pv}$  хорошо соответствует рассчитанной плазменной частоте  $\omega_{pv}$  для «газа свободных электронов», влияние электронов оставших уровней обнаруживается при вычислении сумм (5), (6). Взаимодействие валентных электронов с электронами оставших уровней приводит к тому, что величина  $n_{\text{эфф}}(\hbar\omega)$  уже

при  $\hbar\omega \simeq 11.3$  эВ становится больше четырех. Однако экранирующее действие электронов оставных уровней вследствие их вклада в поляризуемость практически компенсирует их вклад в  $n_{\text{эфф}}$ . В теллуриде свинца ближайший оставной уровень  $5d$ -электронов свинца расположен на расстоянии около 18 эВ от потолка валентной зоны. Взаимодействие валентных электронов с электронами оставного  $5d$ -уровня свинца проявляется в заметном отличии плазменной частоты валентных электронов  $\hbar\Omega_{pe} = 13.1$  эВ от рассчитанной частоты  $\hbar\omega_{pe} = 10.06$  эВ для «газа свободных электронов». Меньший вклад оставных электронов в поляризуемость по сравнению с германием, по-видимому, связан с тем, что только половина узлов кристаллической решетки теллурида свинца принадлежит атомам свинца, которые обусловливают основной вклад в поляризуемость.

В заключение авторы выражают благодарность Е. С. Глускину и персоналу комплекса ВЭПП-2 Института ядерной физики СО АН за предоставленные возможности для проведения экспериментов.

#### Список литературы

- [1] Макаров О. А., Неизвестный И. Г., Синюков М. П. // Письма в ЖЭТФ. 1983. Т. 37. № 10. С. 476—479.
- [2] Bizyaev S. L., Makarov O. A., Sinyukov M. P. // Nucl. Instr. and Methods. 1987. V. A261. P. 126—127.
- [3] Филипп Х., Эренрайх Х. // Оптические свойства полупроводников. М.: Мир, 1970. С. 103—135.
- [4] Makarov O. A., Sinyukov M. P., Gluskin E. S., Zakharov V. M. // Nucl. Instr. and Methods. 1983. V. 208. P. 419—421.
- [5] Lowney J. R., Senturia S. D. // J. Appl. Phys. 1976. V. 47. N 5. P. 1771—1774.

Институт физики полупроводников  
СО АН СССР  
Новосибирск

Поступило в Редакцию  
13 апреля 1989 г.